



Title of Change:	Replace Ag plated lead frame with Cu plated lead frame for SC88 parts at Leshan, China			
Proposed First Ship date:	21 Aug 2021 or earlier if approved by customer			
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Song Huajun < h.j.song@lps.com.cn >			
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < PCN.samples@onsemi.com >. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.			
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or ffvf9f@onsemi.com			
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com			
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Products (listed on this PCN) assembled with the Cu plated lead frame in ON Semiconductor facility, Leshan, China, will have a Finish Good Date Code from about Week 33, 2021 or earlier			
Change Category:	Assembly Change			
Change Sub-Category(s):	Material Change			
Sites Affected:				
ON Semiconductor Sites			External Foundry/Subcon Sites	
Leshan Phoenix Semiconductor, China			None	
Description and Purpose:				
Change description is in below table. The purpose is to unify mass production BOM (Bill Of Material).				
Reliability Qualification and electrical characterization can be provided upon customer request.				
	Before Change Description	After Change Description		
Lead Frame	Ag plated lead frame	Cu plated lead frame		
There is no product marking change.				
Reliability Data Summary:				
QV DEVICE NAME: <u>NVJS3151PT1G</u>				
RMS: <u>65482</u>				
PACKAGE: <u>SC88</u>				
Test	Specification	Condition	Interval	Results
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	30K cyc	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	1000 cyc	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs	0/231
uHAST	JESD22-A118	110°C, 85% RH, 3psig, unbiased	264 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	-	-

QV DEVICE NAME: **NVJD4152PT1G**RMS: **67237**PACKAGE: **SC88**

Test	Specification	Condition	Interval	Results
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	30K cyc	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	1000 cyc	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs	0/231
uHAST	JESD22-A118	110°C, 85% RH, 3psig, unbiased	264 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	-	-

Electrical Characteristics Summary:

Electrical characteristics are not impacted, data can be provided upon customer requested.

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
NTJS3151PT2G	NA
NTJS3151PT1G	NA
NTJD5121NT2G	NA
NTJD5121NT1G	NA
NTJD4158CT1G	NA
NTJD4152PT2G	NA
NTJD4152PT1G	NA
NTJD1155LT1G	NA
NTJD1155LT2G	NA
NTJS4405NT1G	NA

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号 : FPCN23098X

発行日 : 14 May 2021

変更件名:	楽山(中国)における SC88 製品のリードフレームを銀メッキから銅メッキに変更
初回出荷予定日:	21 Aug 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前.
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < h.j.song@lps.com.cn > にお問い合わせください。
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。 サンプルは、イニシアル PCN またはファイナル PCN の初回通知の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。
追加の信頼性データ:	最寄りのオン・セミコンダクター営業所または < ffvf9f@onsemi.com > にお問い合わせください
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、< PCN.Support@onsemi.com > 宛てをお願いします。
変更部品の識別:	楽山 (中国) のオン・セミコンダクター施設において銅メッキ リードフレームで組み立てられる製品 (本 PCN に記載) には、2021 年第 33 営業週以降の完成品日付コードが付けられます
変更カテゴリ:	アセンブリの変更
変更サブカテゴリ:	材料の変更

影響を受ける拠点:

オン・セミコンダクター拠点:

Leshan Phoenix Semiconductor, China

外部製造工場 / 下請業者拠点:

なし

説明および目的:

変更の説明は以下の表に記されています。目的は大量生産の BOM (部品表) を統一することです。

信頼性認証および電気特性はお客様のご要望に応じて提供できます。

	変更前の表記	変更後の表記
リードフレーム	銀めっきリードフレーム	銅めっきリードフレーム

製品マーキングの変更はありません。

信頼性データの要約:

デバイス名: NVJS3151PT1GRMS : 65482パッケージ : SC88

テスト	仕様	条件	間隔	結果
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	30K cyc	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	1000 cyc	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs	0/231
uHAST	JESD22-A118	110°C, 85% RH, 3psig, unbiased	264 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	-	-



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN23098X

発行日: 14 May 2021

デバイス名: NVJD4152PT1GRMS : 67237パッケージ: SC88

テスト	仕様	条件	間隔	結果
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	30K cyc	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	1000 cyc	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs	0/231
uHAST	JESD22-A118	110°C, 85% RH, 3psig, unbiased	264 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	-	-

電気的特性の要約:

電気的特性に影響はありません。データはお客様のご要望に応じて提供できます。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
NTJS3151PT2G	NA
NTJS3151PT1G	NA
NTJD5121NT2G	NA
NTJD5121NT1G	NA
NTJD4158CT1G	NA
NTJD4152PT2G	NA
NTJD4152PT1G	NA
NTJD1155LT1G	NA
NTJD1155LT2G	NA
NTJS4405NT1G	NA



Appendix A: Changed Products

PCN#: FPCN23098X
Issue Date: May 14, 2021

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle	New Part Number	Replacement Supplier
NTJS3151PT1G		NA	NA	
NTJD5121NT2G		NA	NA	
NTJD5121NT1G		NA	NA	
NTJD4158CT1G		NA	NA	
NTJD4152PT2G		NA	NA	
NTJD4152PT1G		NA	NA	
NTJD1155LT1G		NA	NA	
NTJS4405NT1G		NA	NA	